

研究開発

特許製品を数多く所有する当社では、これらを社会に送り出すまでに、実際の使用条件を想定したいくつもの実験を行っています。最新の検証技術によって支えられている研究・開発は、更なる高みを目指して進化し続けています。

新たなる価値を求め、未知なる素材の研究・開発に努めて



ICP-MS

元素分析装置の一つで、プラズマにより液体試料中に含まれる元素をイオン化することで微量元素の定性・定量評価を行います。

※アジレント・テクノロジーから許可を受けて掲載



大型高速試験機

実機における過酷な使用条件でのメカニカルシールの性能評価に使用する高圧・高速回転試験機です。



解析ソフト (CAE)

構造解析・流体解析により、製品仕様に応じた最適なシール形状、流路形状を定量的に検討し、製品の設計・提案につなげています。



高圧弁用試験装置&高圧ガスブスター

100MPaまでの圧力条件下における漏洩量、摺動荷重、締め付け圧力などのデータが採取可能で、高圧対応パッキンの開発などに活用しています。



半導体・液晶製造装置用製品実験室

半導体市場で使用される各種薬液に対応するために、中和装置を完備した実験室を保有しています。



弁用横型試験装置及び自動データロガー

弁を模した試験装置であり、高温から低温までの幅広い温度や圧力を負荷した条件下における漏洩量、摺動荷重、締め付け圧力などのデータを自動採取します。

品質保証

製品開発から設計・生産・販売・アフターサービスに至る全ての段階で求められるクオリティを実現するために、社内品質保証組織全てがお互いに協力し、一丸となって社是の「品質第一」を基本に時代の要請に応える品質の提供を目指しています。

あらゆる分野に世界品質を届け続けて



分析走査電子顕微鏡 (SEM)

電子線を走査照射し、磁場型レンズで発生した信号を画像として捉えるほか、物質に含まれる元素の特定も可能です。主に開発品の表面観察、返却品の破断面観察や異物調査などで使用しています。



X線回折装置 (XRD)

X線を角度変化させながら照射することで、照射角度とX線強度から構成元素が同じ物質でも結晶構造の違いから識別・特定することが可能です。主に開発品の結晶構造の確認などで使用しています。



赤外分光装置 (IR)

波長変化させた赤外線を連続的に照射し、分子固有の振動エネルギーに対応した特有のスペクトルから分子構造を特定することができます。主にゴム材料の確認や返却品の異物調査などで使用しています。



熱機械分析装置 (TMA)

低温から高温まで広範囲に物質を加熱・冷却することができ、熱膨張、熱収縮、軟化などの熱機械特性を測定します。主に開発品の線膨張係数などの確認で使用しています。